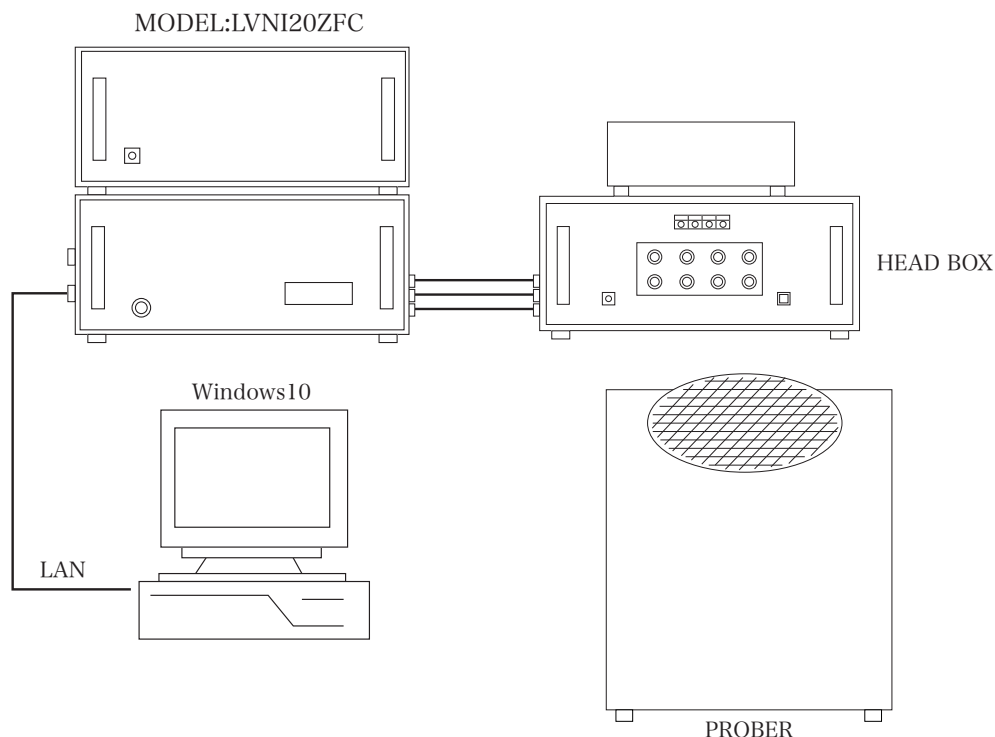


INDUCTIVE LOAD TESTER / 半導体L負荷試験器

LVNI20ZFC

LVNI20ZFC can carry out IGSS, IDSS test and inductive load test under the state of wafer in succession. Also, this tester has high-speed power supply break function to protect it at device destruction.

ウェハー状態でのL負荷試験および、IGSS, IDSS測定を一連で行うことができるシステムです。素子破壊時の保護機能として、高速電源遮断機能も盛り込まれています。



【L load Measurement Specifications / L負荷測定仕様】

- 1) Voltage / 電圧 : 150V
- 2) Current / 電流 : 200A

【IGSS・IDSS Measurement Specifications / IGSS・IDSS測定仕様】

- 1) Voltage / 電圧 : 100V
- 2) Current / 電流 : 100uA



半導体デバイス試験装置メーカー

株式会社 キヤッツ電子設計

CONTACT

■TEL : CATS Inc. SENDAI OFFICE TEL.022-371-8777

■E-mail : cats-sendai@world.ocn.ne.jp

* Reproduction or appropriation of writings, images and photographs from within this catalogue is prohibited.

* 本カタログ内の記述、画像、写真の無断転載・転用を禁止します。